

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第5734189号

(P5734189)

(45) 発行日 平成27年6月17日 (2015. 6. 17)

(24) 登録日 平成27年4月24日 (2015. 4. 24)

(51) Int. Cl.

F I

C03C	3/085	(2006.01)	C03C	3/085
C03C	3/087	(2006.01)	C03C	3/087
C03C	3/095	(2006.01)	C03C	3/095
C03C	3/078	(2006.01)	C03C	3/078
C03C	3/097	(2006.01)	C03C	3/097

請求項の数 21 (全 29 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2011-526751 (P2011-526751)
 (86) (22) 出願日 平成22年8月9日 (2010. 8. 9)
 (86) 国際出願番号 PCT/JP2010/063451
 (87) 国際公開番号 W02011/019010
 (87) 国際公開日 平成23年2月17日 (2011. 2. 17)
 審査請求日 平成25年3月15日 (2013. 3. 15)
 (31) 優先権主張番号 特願2009-185976 (P2009-185976)
 (32) 優先日 平成21年8月10日 (2009. 8. 10)
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)

(73) 特許権者 000113263
 H O Y A 株式会社
 東京都新宿区中落合2丁目7番5号
 (74) 代理人 110000109
 特許業務法人特許事務所サイクス
 (72) 発明者 松本 奈緒美
 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 H O
 Y A 株式会社内
 (72) 発明者 蜂谷 洋一
 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 H O
 Y A 株式会社内
 (72) 発明者 越阪部 基延
 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 H O
 Y A 株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 磁気記録媒体基板用ガラス、磁気記録媒体基板およびその製造方法、ならびに磁気記録媒体

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

モル%表示にて、

S i O ₂ を 5 0 ~ 7 5 %、A l ₂ O ₃ を 0 ~ 5 %、

Z n O を 0 ~ 5 %、

N a ₂ O および K ₂ O を合計で 3 ~ 1 5 %、

M g O、C a O、S r O および B a O を合計で 1 4 ~ 3 5 %、

Z r O ₂、T i O ₂、L a ₂ O ₃、Y ₂ O ₃、Y b ₂ O ₃、T a ₂ O ₅、N b ₂ O ₅ およ
 び H f O ₂ を合計で 2 ~ 9 %、含み、L i ₂ O を実質的に含まず、モル比 { (M g O + C a O) / (M g O + C a O + S r O + B a O) } が 0 . 8 5 ~ 1 の 範
 囲であり、モル比 { A l ₂ O ₃ / (M g O + C a O) } が 0 ~ 0 . 3 0 の 範 囲 であ り、かつ
 比弾性率が 3 0 M N m / k g 以上である磁気記録媒体基板用ガラス。

【請求項 2】

1 0 0 ~ 3 0 0 における平均線膨張係数が 7 0 × 1 0 ⁻⁷ / 以上、かつ ガラス転移温
 度が 6 3 0 以 上 である請求項 1 に記載の磁気記録媒体基板用ガラス。

【請求項 3】

比重が 3 . 0 未満である請求項 1 または 2 に記載の磁気記録媒体基板用ガラス。

【請求項 4】

45 に保たれた 1.7 質量%の珪弗酸水溶液に浸漬した場合のエッチングレートが $0.09 \mu\text{m}/\text{分}$ 以下となる耐酸性を備える請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項に記載の磁気記録媒体基板用ガラス。

【請求項 5】

液相温度が 1300 以下である請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載の磁気記録媒体基板用ガラス。

【請求項 6】

モル%表示にて、CaO を 6 ~ 21 % 含む請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 項に記載の磁気記録媒体基板用ガラス。

【請求項 7】

モル%表示にて、 K_2O を 1 ~ 10 % 含む請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 項に記載の磁気記録媒体基板用ガラス。

【請求項 8】

モル比 $(\text{Al}_2\text{O}_3 / \text{CaO})$ が 0 ~ 0.4 の範囲である請求項 1 ~ 7 のいずれか 1 項に記載の磁気記録媒体基板用ガラス。

【請求項 9】

モル比 $(\text{Al}_2\text{O}_3 / (\text{MgO} + \text{CaO}))$ が 0 ~ 0.1 の範囲である請求項 1 ~ 8 のいずれか 1 項に記載の磁気記録媒体基板用ガラス。

【請求項 10】

モル%表示にて、

SiO_2 を 50 ~ 75 %、

B_2O_3 を 0 ~ 3 %、

Al_2O_3 を 0 ~ 5 %、

Na_2O を 0 ~ 5 %、

K_2O を 1 ~ 10 %、

MgO を 1 ~ 23 %、

CaO を 6 ~ 21 %、

BaO を 0 ~ 5 %、

ZnO を 0 ~ 5 %、

TiO_2 を 0 ~ 5 %、

ZrO_2 を 2 ~ 9 %、

含む請求項 1 ~ 9 のいずれか 1 項に記載の磁気記録媒体基板用ガラス。

【請求項 11】

SiO_2 の含有量が 57 ~ 68 モル%の範囲である請求項 1 ~ 10 のいずれか 1 項に記載の磁気記録媒体基板用ガラス。

【請求項 12】

Al_2O_3 の含有量が 0.1 ~ 4 モル%の範囲である請求項 1 ~ 11 のいずれか 1 項に記載の磁気記録媒体基板用ガラス。

【請求項 13】

ZnO の含有量が 0 ~ 2 モル%の範囲である請求項 1 ~ 12 のいずれか 1 項に記載の磁気記録媒体基板用ガラス。

【請求項 14】

請求項 1 ~ 13 のいずれか 1 項に記載のガラスからなる磁気記録媒体基板。

【請求項 15】

表面の一部または全部にイオン交換層を有する請求項 14 に記載の磁気記録媒体基板。

【請求項 16】

前記イオン交換層が、K、Rb および Cs からなる群から選ばれる少なくとも 1 種のアルカリ金属イオンとのイオン交換により形成されたものである請求項 15 に記載の磁気記録媒体基板。

【請求項 17】

10

20

30

40

50

ディスク形状であって、かつ主表面が下記(1)～(3)の表面性を有する請求項14～16のいずれか1項に記載の磁気記録媒体基板。

(1) 原子間力顕微鏡を用いて $1\mu\text{m} \times 1\mu\text{m}$ の範囲で測定される表面粗さの算術平均Raが 0.25nm 以下；

(2) $5\mu\text{m} \times 5\mu\text{m}$ の範囲で測定される表面粗さの算術平均Raが 0.15nm 以下；

(3) 波長 $100\mu\text{m} \sim 950\mu\text{m}$ における表面うねりの算術平均Waが 0.5nm 以下

【請求項18】

ガラス原料を加熱することにより熔融ガラスを調製し、該熔融ガラスをプレス成形法、ダウンドロー法またはフロート法のいずれかの方法により板状に成形し、得られた板状のガラスを加工する工程を経て請求項14～17のいずれか1項に記載の磁気記録媒体基板を作製する磁気記録媒体基板の製造方法。

【請求項19】

請求項14～17のいずれか1項に記載の基板上に磁気記録層を有する磁気記録媒体。

【請求項20】

前記磁気記録層は、FeおよびPtを含むか、またはCoおよびPtを含む請求項19に記載の磁気記録媒体。

【請求項21】

エネルギーアシスト記録方式に使用される請求項19または20に記載の磁気記録媒体。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、ハードディスク等の磁気記録媒体の基板として使用されるガラス、および前記ガラスからなる磁気記録媒体基板およびその製造方法、ならびにこの基板を備える磁気記録媒体に関する。

【背景技術】

【0002】

インターネットなど、情報関連インフラ技術の進展に伴い、磁気ディスク、光ディスクなどの情報記録媒体の需要は急速に伸びている。コンピュータなどの磁気記憶装置の主要構成要素は、磁気記録媒体と磁気記録再生用の磁気ヘッドである。磁気記録媒体としてはフレキシブルディスクとハードディスクとが知られている。このうちハードディスク（磁気ディスク）用の基板材料としては、例えば、アルミニウム基板、ガラス基板、セラミック基板、カーボン基板等があり、実用的には、サイズや用途に応じて、主に、アルミニウム基板とガラス基板とが使用されている。ノートパソコン用ハードディスクドライブにおいては、耐衝撃性に加えて、磁気記録媒体の高密度記録化と薄型化に伴いディスク基板の表面平滑性の向上と基板の薄型化への要求はますます厳しくなっているため、表面硬度、剛性に劣るアルミニウム基板で対応するには限界がある。そこでガラス基板の開発が、現在主流となっている（例えば文献1（特表平9-507206号公報）、文献2（特開2007-51064号公報）、文献3（特開2001-294441号公報）、文献4（特開2001-134925号公報）、文献5（特開2001-348246号公報）、文献6（特開2001-58843号公報）、文献7（特開2006-327935号公報）、文献8（特開2005-272212号公報）、文献9（特開2004-43295号公報）、文献10（特開2005-314159号公報）参照）。

【0003】

また近年、磁気記録媒体のより一層の高密度記録化を図ることを目的として、Fe-Pt系、Co-Pt系等の磁気異方性エネルギーが高い磁性材料（高Ku磁性材料）を使用することが検討されている（例えば文献11（特開2004-362746号公報）参照）。高記録密度化のためには磁性粒子の粒径を小さくする必要があるが、一方で、粒径が小さくなると、熱揺らぎによる磁気特性の劣化が問題となる。高Ku磁性材料は熱揺らぎの影響を受けにくいいため、高密度記録化に寄与すると期待されている。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかし上記高Ku磁性材料は、高Kuを実現するために特定の結晶配向状態を得る必要があり、そのため、高温での成膜、あるいは成膜後に高温で熱処理を行う必要がある。したがって、これらの高Ku磁性材料からなる磁気記録層を形成するためには、ガラス基板には上記高温処理に耐え得る高い耐熱性、即ち高いガラス転移温度を有することが求められる。

【0005】

ところでディスク状の磁気記録媒体では、媒体を中心軸の周りに高速回転させつつ、磁気ヘッドを半径方向に移動させながら、回転方向に沿ってデータの書き込み、読み出しを行う。近年、この書き込み速度および読み出し速度を上げるため回転数は5400rpmから7200rpm、更には10000rpmと高速化する方向で進んでいるが、ディスク状の磁気記録媒体では、予め、中心軸からの距離に応じてデータを記録するポジションが割り当てられるため、ディスクが回転中に変形を起こすと磁気ヘッドの位置ズレが起こり、正確な読み取りが困難となる。したがって上記高速回転化に対応するために、ガラス基板には高速回転時に大きな変形を起こさない高い剛性（ヤング率、および比弾性率）を有することも求められる。

【0006】

更に本願発明者らの検討により、高い熱膨張係数を有するガラス基板を使用することにより、磁気記録媒体の記録再生の信頼性を高めることができることが明らかとなった。これは以下の理由による。

磁気記録媒体を組み込んだHDD（ハードディスクドライブ）は、中央部分をスピンドルモーターのスピンドルで押さえて磁気記録媒体そのものを回転させる構造となっている。そのため、磁気記録媒体基板とスピンドル部分を構成するスピンドル材料の各々の熱膨張係数に大きな差があると、使用時に周囲の温度変化に対してスピンドルの熱膨張・熱収縮と磁気記録媒体基板の熱膨張・熱収縮にずれが生じてしまい、結果として磁気記録媒体が変形してしまう現象が起きる。このような現象が生じると書き込んだ情報をヘッドが読み出せなくなってしまう、記録再生の信頼性を損なう原因となる。したがって磁気記録媒体の信頼性を高めるには、ガラス基板には、スピンドル材料（例えばステンレスなど）と同程度の高い熱膨張係数を有することが求められる。

【0007】

以上説明したように、更なる高密度記録化に対応可能な磁気記録媒体を提供するためには、高耐熱性、高剛性、高熱膨張係数という3つの特性を兼ね備えたガラス基板が求められる。しかし本願発明者らの検討によれば、上記文献1～10に記載のガラス基板をはじめとする従来のガラス基板には、これら3つの特性を同時に満たすものはなかった。これは、これら3つの特性がトレードオフの関係にあり、すべてを満たすガラス基板を実現することが困難であったからである。

【0008】

そこで本発明の目的は、高い耐熱性、高剛性、高熱膨張係数という3つの特性を兼ね備えたガラス基板、より詳しくは、高いガラス転移温度、高ヤング率および高熱膨張係数を有するガラス基板を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本願発明者らは、上記目的を達成するために相当数のガラス組成の試作と評価を繰り返し試行錯誤を重ねた結果、下記組成を有するガラスが、高い耐熱性、高剛性、高熱膨張係数という、従来は同時に実現することが困難であった3つの特性を兼ね備えていることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0010】

本発明の一態様は、

10

20

30

40

50

モル％表示にて、

SiO_2 を50～75％、

Al_2O_3 を0～5％、

Li_2O を0～3％、

ZnO を0～5％、

Na_2O および K_2O を合計で3～15％、

MgO 、 CaO 、 SrO および BaO を合計で14～35％、

ZrO_2 、 TiO_2 、 La_2O_3 、 Y_2O_3 、 Yb_2O_3 、 Ta_2O_5 、 Nb_2O_5 および HfO_2 を合計で2～9％、

含み、

モル比 $[(\text{MgO} + \text{CaO}) / (\text{MgO} + \text{CaO} + \text{SrO} + \text{BaO})]$ が0.85～1の範囲であり、かつモル比 $[\text{Al}_2\text{O}_3 / (\text{MgO} + \text{CaO})]$ が0～0.30の範囲である磁気記録媒体基板用ガラス

に関する。

【0011】

上記ガラスは、 $70 \times 10^{-7} /$ 以上の100～300における平均線膨張係数、630以上のガラス転移温度、かつ80GPa以上のヤング率を有することができる。

【0012】

上記ガラスは、30MNm/kg以上の比弾性率を有することができる。

【0013】

上記ガラスは、3.0未満の比重を有することができる。

【0014】

上記ガラスは、45に保たれた1.7質量％の珪弗酸水溶液に浸漬した場合のエッチングレートが0.09μm/分以下となる耐酸性を備えることができる。

【0015】

上記ガラスは、1300以下の液相温度を有することができる。

【0016】

上記ガラスは、

モル％表示にて、

SiO_2 を50～75％、

B_2O_3 を0～3％、

Al_2O_3 を0～5％、

Li_2O を0～3％、

Na_2O を0～5％、

K_2O を1～10％、

MgO を1～23％、

CaO を6～21％、

BaO を0～5％、

ZnO を0～5％、

TiO_2 を0～5％、

ZrO_2 を2～9％、

含むことができる。

【0017】

上記ガラスは、 SiO_2 の含有量が57～68モル％の範囲であることができる。

【0018】

上記ガラスは、 Al_2O_3 の含有量が0.1～4モル％の範囲であることができる。

【0019】

上記ガラスは、 Li_2O を実質的に含まないガラスであることができる。

【0020】

上記ガラスは、 ZnO の含有量が0～2モル％の範囲であることができる。

10

20

30

40

50

【 0 0 2 1 】

本発明の更なる態様は、上記ガラスからなる磁気記録媒体基板に関する。

【 0 0 2 2 】

上記磁気記録媒体基板は、表面の一部または全部にイオン交換層を有することができる。

【 0 0 2 3 】

上記イオン交換層は、K、RbおよびCsからなる群から選ばれる少なくとも1種のアルカリ金属イオンとのイオン交換により形成されたものであることができる。

【 0 0 2 4 】

上記磁気記録媒体基板は、ディスク形状であって、かつ主表面が下記(1)~(3)の表面性を有するものであることができる。

(1) 原子間力顕微鏡を用いて $1\mu\text{m} \times 1\mu\text{m}$ の範囲で測定される表面粗さの算術平均Raが 0.25nm 以下；

(2) $5\mu\text{m} \times 5\mu\text{m}$ の範囲で測定される表面粗さの算術平均Raが 0.15nm 以下；

(3) 波長 $100\mu\text{m} \sim 950\mu\text{m}$ における表面うねりの算術平均Waが 0.5nm 以下。

【 0 0 2 5 】

本発明の更に別の態様は、ガラス原料を加熱することにより熔融ガラスを調製し、該熔融ガラスをプレス成形法、ダウンドロー法またはフロート法のいずれかの方法により板状に成形し、得られた板状のガラスを加工する工程を経て上記磁気記録媒体基板を作製する磁気記録媒体基板の製造方法に関する。

【 0 0 2 6 】

本発明の更に別の態様は、上記基板上に磁気記録層を有する磁気記録媒体に関する。

【 0 0 2 7 】

上記磁気記録層は、FeおよびPtを含むか、またはCoおよびPtを含むことができる。

【 0 0 2 8 】

上記磁気記録媒体は、エネルギーアシスト記録方式に使用されることができる。

【発明の効果】

【 0 0 2 9 】

本発明によれば、高Ku磁性材料からなる磁気記録層を形成する際の高温熱処理に耐え得る高い耐熱性を有するとともに、支持部材(スピンドル)に匹敵する高い熱膨張係数を有し、かつ高速回転に耐え得る高い剛性を有する磁気記録媒体用ガラス基板を実現可能にする磁気記録媒体基板用ガラス、このガラスからなる磁気記録媒体基板およびその製造方法、ならびにこの基板を有する磁気記録媒体を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 3 0 】

【図1】図1は、抗折強度の測定方法の説明図である。

【発明を実施するための形態】

【 0 0 3 1 】

[磁気記録媒体基板用ガラス]

本発明の磁気記録媒体基板用ガラス(以下、「本発明のガラス」ともいう)は、モル%表示にて、

SiO₂を50~75%、

Al₂O₃を0~5%、

Li₂Oを0~3%、

ZnOを0~5%、

Na₂OおよびK₂Oを合計で3~15%、

MgO、CaO、SrOおよびBaOを合計で14~35%、

ZrO₂、TiO₂、La₂O₃、Y₂O₃、Yb₂O₃、Ta₂O₅、Nb₂O₅およびHfO₂を

10

20

30

40

50

合計で 2 ~ 9 %、
含み、

モル比 $[(MgO + CaO) / (MgO + CaO + SrO + BaO)]$ が 0.85 ~ 1 の範囲であり、かつモル比 $[Al_2O_3 / (MgO + CaO)]$ が 0 ~ 0.30 の範囲である磁気記録媒体基板用ガラスである。

本発明の磁気記録媒体基板用ガラスは酸化物ガラスに分類されるものであり、そのガラス組成は酸化物基準で表示するものとする。酸化物基準のガラス組成とは、ガラス原料が熔融時にすべて分解されてガラス中で酸化物として存在するものとして換算することにより得られるガラス組成である。上記組成を有する本発明のガラスによれば、高い耐熱性、高剛性、高熱膨張係数という 3 つの特性を兼ね備えた磁気記録媒体基板を提供することができる。なお、本発明のガラスは、非晶質性（アモルファス）のガラスである。したがって、結晶化ガラスとは異なり均質相からなるため、優れた基板表面の平滑性を実現することができる。

以下、本発明のガラスについて、更に詳細に説明する。以下において、特記しない限り、各成分の含有量、合計含有量、比率はモル基準で表示するものとする。

【0032】

SiO_2 は、ガラスのネットワーク形成成分であり、ガラス安定性、化学的耐久性、特に耐酸性を向上させる効果がある。磁気記録媒体基板上に磁気記録層等を成膜する工程や前記工程により形成した膜を熱処理するため、輻射によって基板を加熱する際、基板の熱拡散を低下させ、加熱効率を高める働きをする成分でもある。 SiO_2 の含有量が 50 % 未満では上記働きを十分得ることができず、75 % を超えると SiO_2 が完全に熔けずにガラス中に未溶解物が生じたり、清澄時のガラスの粘性が高くなりすぎて泡切れが不十分になる。未溶解物を含むガラスから基板を作製すると、研磨によって基板表面に未溶解物による突起が生じ、極めて高い表面平滑性が求められる磁気記録媒体基板としては使用できなくなる。また、泡を含むガラスから基板を作製すると、研磨によって基板表面に泡の一部が現れ、その部分が窪みとなって基板の主表面の平滑性が損なわれるため、やはり磁気記録媒体基板として使用できなくなる。以上より、 SiO_2 の含有量は 50 ~ 75 % とする。 SiO_2 の含有量の好ましい範囲は 57 ~ 70 %、より好ましい範囲は 57 ~ 68 %、さらに好ましい範囲は 60 ~ 68 %、一層好ましい範囲は 63 ~ 68 % である。

【0033】

Al_2O_3 もガラスのネットワーク形成に寄与し、化学的耐久性、耐熱性を向上させる働きをする成分である。ただし Al_2O_3 の含有量が 5 % を超えるとガラスの熱膨張係数が小さくなりすぎ、HDD のスピンドル部分を構成するスピンドル材料、例えばステンレスとの熱膨張係数の差が大きくなり、周囲の温度変化に対してスピンドルの熱膨張・熱収縮と磁気記録媒体基板の熱膨張・熱収縮にずれが生じ、結果として磁気記録媒体が変形してしまう現象が起きやすくなる。このような現象が生じると書き込んだ情報をヘッドが読み出せなくなってしまう、記録再生の信頼性を損なう原因となる。したがって、 Al_2O_3 の含有量は 0 ~ 5 % とする。 Al_2O_3 は、少量であればガラス安定性を改善させ、液相温度を低下させる働きをするが、その含有量を更に増加させていくとガラス安定性が低下し、液相温度が上昇する傾向を示す。そのため、更なる高熱膨張化に加え、ガラス安定性を一層改善する上から、 Al_2O_3 の含有量の好ましい上限は 4 %、より好ましい上限は 3 % であり、さらに好ましい上限は 2.5 % であり、一層好ましい上限は 1 % であり、より一層好ましい範囲は 1 % 未満である。一方、化学的耐久性、耐熱性、ガラス安定性を改善する上から、 Al_2O_3 の含有量の好ましい下限は 0.1 % である。

【0034】

Li_2O は、ガラスの熔融性および成形性を向上させる働きをするとともに熱膨張係数を増加させる働きをするが、少量の導入でガラス転移温度が大幅に低下し、耐熱性が著しく低下するため、 Li_2O の含有量は 0 ~ 3 % とする。耐熱性を一層向上させる上から、 Li_2O の含有量の好ましい範囲は 0 ~ 2 %、より好ましい範囲は 0 ~ 1 %、さらに好ましい範囲は 0 ~ 0.8 %、一層好ましい範囲は 0 ~ 0.5 %、より一層好ましい範囲は 0

～ 0.1%、さらに一層好ましい範囲は0～0.08%であり、 Li_2O を実質的に含まないことが特に好ましい。ここで、「実質的に含まない」とは、ガラス原料中に意図して特定の成分を加えないことを意味し、不純物として混入することまで排除するものではない。

【0035】

ZnO は、ガラスの熔融性、成形性およびガラス安定性を良化し、剛性を高め、熱膨張係数を大きくする働きをする。しかし、過剰に導入するとガラス転移温度が大幅に低下し、耐熱性が著しく低下したり、化学的耐久性が低下する。したがって、 ZnO の含有量は0～5%とする。耐熱性、化学的耐久性を良好な状態に維持する上から、 ZnO の含有量の好ましい範囲は0～4%、より好ましい範囲は0～3%、さらに好ましい範囲は0～2%、一層好ましい範囲は0～1%、より一層好ましい範囲は0～0.5%であり、 ZnO を実質的に含有させなくてもよい。

10

【0036】

Na_2O および K_2O は、ガラスの熔融性および成形性を向上させる働き、清澄時にガラスの粘性を低下させて、泡切れを促進させる働きをするとともに熱膨張係数を増加させる働きの大きい成分であり、アルカリ成分中、 Li_2O と比べてガラス転移温度を低下させる働きが小さい。本発明のガラスにおいては、磁気記録媒体基板に要求される均質性（未溶解物や残留泡のない状態）、熱膨張特性を付与させる上から、 Na_2O および K_2O の合計含有量を3%以上とする。ただし前記合計含有量が15%を越えると、ガラス転移温度が低下し、耐熱性が損なわれる、化学的耐久性、特に耐酸性が低下する、基板表面からのアルカリ溶出が増大し、析出したアルカリが基板上に形成した膜などに損傷を与えるなどの問題が発生するため、 Na_2O および K_2O の合計含有量を3～15%とする。 Na_2O および K_2O の合計含有量の好ましい範囲は5～13%、より好ましい範囲は8～13%、さらに好ましい範囲は8～11%である。

20

【0037】

本発明のガラスは、イオン交換することなく磁気記録媒体基板として使用してもよく、イオン交換を行った後に磁気記録媒体基板として使用してもよい。イオン交換を行う場合、 Na_2O はイオン交換を担う成分として好適な成分である。また、 Na_2O と K_2O とをガラス成分として共存させ、混合アルカリ効果によってアルカリ溶出抑制効果を得ることもできる。しかし、両成分を過剰に導入すると、両成分の合計含有量を過剰にしたときと同様の問題が生じやすくなる。この点から、 Na_2O および K_2O の合計含有量を上記範囲にした上で、 Na_2O の含有量の範囲を0～5%とすることが好ましく、0.1～5%とすることがより好ましく、1～5%とすることがより好ましく、2～5%とすることがより好ましく、 K_2O の含有量の範囲は1～10%とすることが好ましく、1～9%とすることがより好ましく、1～8%とすることがさらに好ましく、3～8%とすることが一層好ましく、5～8%とすることがより一層好ましい。

30

【0038】

アルカリ土類金属成分である MgO 、 CaO 、 SrO 、 BaO は、いずれもガラスの熔融性、成形性およびガラス安定性を良化し、熱膨張係数を大きくする働きをするが、 MgO 、 CaO 、 SrO および BaO の合計含有量が14%未満では、前記所要の効果を得ることができない。一方、 MgO 、 CaO 、 SrO および BaO の合計含有量が35%を超えると化学的耐久性が低下する。したがって本発明のガラスにおいては、 MgO 、 CaO 、 SrO および BaO の合計含有量を14～35%とする。 MgO 、 CaO 、 SrO および BaO の合計含有量の好ましい範囲は14～32%、より好ましい範囲は14～26%、さらに好ましい範囲は15～26%、一層好ましい範囲は17～25%である。

40

【0039】

ところで、モバイル用途に使用される磁気記録媒体の基板には、持ち運び時の衝撃に耐える高い剛性および硬度を有すること、ならびに軽量であることが求められる。したがって、かかる基板を製造するためのガラスは、高ヤング率、高比弾性率、低比重であることが望ましい。また、先に説明したように高速回転に耐えるためにも、磁気記録媒体基板用

50

ガラスには高剛性であることが求められる。前記アルカリ土類金属成分のうち、 MgO 、 CaO は、剛性および硬度を高めるとともに、比重の増加を抑える働きがある。したがって、高ヤング率、高比弾性率、低比重のガラスを得る上で非常に有用な成分である。特に MgO は高ヤング率化、低比重化に有効であり、 CaO は高熱膨張化に有効な成分である。したがって本発明のガラスにおいて、ガラスを高ヤング率化、高比弾性率化、低比重化する上から、 MgO 、 CaO 、 SrO および BaO の合計含有量 ($MgO + CaO + SrO + BaO$) に対する MgO および CaO の合計含有量のモル比 ($(MgO + CaO) / (MgO + CaO + SrO + BaO)$) を $0.85 \sim 1$ の範囲とする。前記モル比が 0.85 未満では、ヤング率、比弾性率が低下したり、比重が増大するなどの問題が生じる。なお、前記モル比の上限は、 SrO 、 BaO が含まれない場合に最大値 1 となる。モル比 ($(MgO + CaO) / (MgO + CaO + SrO + BaO)$) の好ましい範囲は $0.88 \sim 1$ 、さらに好ましい範囲は $0.89 \sim 1$ 、一層好ましい範囲は $0.9 \sim 1$ 、より一層好ましい範囲は $0.92 \sim 1$ 、さらに一層好ましい範囲は $0.94 \sim 1$ 、なお一層好ましい範囲は $0.96 \sim 1$ 、さらになお一層好ましい範囲は $0.98 \sim 1$ 、特に好ましい範囲は $0.99 \sim 1$ 、最も好ましくは 1 である。

10

【0040】

高ヤング率化、高比弾性率化、低比重化と化学的耐久性の維持の観点から、 MgO の含有量の好ましい範囲は $1 \sim 23\%$ であり、 MgO の含有量の好ましい下限は 2% 、より好ましい下限は 5% であり、 MgO の含有量の好ましい上限は 15% 、より好ましい上限は 8% である。

20

高ヤング率化、高比弾性率化、低比重化、高熱膨張化と化学的耐久性の維持の観点から、 CaO の含有量の好ましい範囲は $6 \sim 21\%$ であり、より好ましい範囲は $10 \sim 20\%$ 、さらに好ましい範囲は $10 \sim 18\%$ 、一層好ましい範囲は $10 \sim 15\%$ である。

なお、上記観点から MgO および CaO の合計含有量の範囲を $15 \sim 35\%$ とすることが好ましく、 $15 \sim 32\%$ とすることがより好ましく、 $15 \sim 30\%$ とすることがさらに好ましく、 $15 \sim 25\%$ とすることが一層好ましく、 $15 \sim 20\%$ とすることがより一層好ましい。

【0041】

SrO は上記効果を有するが、過剰に含有させると比重が増大する。また、 MgO や CaO と比較し、原料コストも増大する。そのため、 SrO の含有量は $0 \sim 5\%$ の範囲とすることが好ましく、 $0 \sim 2\%$ の範囲とすることがより好ましく、 $0 \sim 1\%$ の範囲とすることがさらに好ましく、 $0 \sim 0.5\%$ の範囲とすることがよりいっそう好ましい。 SrO は、本発明の目的を達成する上からガラス成分として導入しなくてもよい、すなわち、本発明のガラスは SrO を実質的に含まないガラスであってもよい。

30

BaO も上記効果を有するが、過剰に含有させると比重が大きくなる、ヤング率が低下する、化学的耐久性が低下する、比重が増加する、原料コストが増大するなどの問題が生じる。また、 BaO を多量に含むガラス基板は、長期使用中にガラス表面が変質しやすい傾向がある。これは、ガラス中の Ba が大気中の二酸化炭素と反応し、基板表面に $BaCO_3$ が析出し付着物となるためと考えられる。このような付着物の発生を低減ないし防止するためにも、 BaO を過剰に含有させないことが望ましい。以上の観点から、本発明のガラスにおける BaO の含有量は $0 \sim 5\%$ とすることが好ましい。 BaO の含有量のより好ましい範囲は $0 \sim 3\%$ 、さらに好ましい範囲は $0 \sim 2\%$ 、一層好ましい範囲は $0 \sim 1\%$ 、より一層好ましい範囲は $0 \sim 0.5\%$ である。 BaO は、本発明の目的を達成する上からガラス成分として導入しなくてもよい、すなわち、本発明のガラスは、 BaO を実質的に含まないガラスであってもよい。

40

上記観点から SrO および BaO の合計含有量を $0 \sim 5\%$ とすることが好ましく、 $0 \sim 3\%$ とすることがより好ましく、 $0 \sim 2\%$ とすることがさらに好ましく、 $0 \sim 1\%$ とすることが一層好ましく、 $0 \sim 0.5\%$ とすることがより一層好ましい。

【0042】

上記のように、 MgO および CaO はヤング率、熱膨張係数を高める効果がある。これ

50

に対し Al_2O_3 はヤング率を高める働きが小さく、熱膨張係数を減少させる働きをする。そこで高ヤング率、高熱膨張のガラスを得る上から、本発明のガラスでは、 MgO および CaO の合計含有量 ($\text{MgO} + \text{CaO}$) に対する Al_2O_3 の含有量のモル比 ($\text{Al}_2\text{O}_3 / (\text{MgO} + \text{CaO})$) を $0 \sim 0.30$ の範囲とする。ガラスの高耐熱性化、高ヤング率化、高熱膨張化は互いにトレードオフの関係があり、これら3つの要求を同時に満たすためには、 Al_2O_3 、 MgO 、 CaO それぞれの含有量を単独で設定する組成調製では不十分であり、上記モル比を所要の範囲にすることが重要である。モル比 ($\text{Al}_2\text{O}_3 / (\text{MgO} + \text{CaO})$) の好ましい範囲は $0 \sim 0.1$ 、より好ましい範囲は $0 \sim 0.05$ 、さらに好ましい範囲は $0 \sim 0.03$ である。

【0043】

MgO 、 CaO のうち高熱膨張化の働きが大きい成分は CaO であるから、必須成分として CaO を含む場合、一層の高熱膨張化を図るためには、 CaO の含有量に対する Al_2O_3 の含有量のモル比 ($\text{Al}_2\text{O}_3 / \text{CaO}$) を $0 \sim 0.4$ の範囲にすることが好ましく、 $0 \sim 0.2$ の範囲にすることがより好ましく、 $0 \sim 0.1$ の範囲にすることがさらに好ましい。

【0044】

ZrO_2 、 TiO_2 、 La_2O_3 、 Y_2O_3 、 Yb_2O_3 、 Ta_2O_5 、 Nb_2O_5 および HfO_2 は、化学的耐久性、特に耐アルカリ性を向上させるとともに、ガラス転移温度を高めて耐熱性を改善し、剛性や破壊靱性を高める働きもする。 ZrO_2 、 TiO_2 、 La_2O_3 、 Y_2O_3 、 Yb_2O_3 、 Ta_2O_5 、 Nb_2O_5 および HfO_2 の合計含有量が2%未満では上記効果を得ることができず、9%を超えるとガラスの熔融性が低下し、ガラス中に未溶解物が残り、平滑性の優れた基板を得ることが困難になる、比重が増大するなどの問題が生じる。したがって、 ZrO_2 、 TiO_2 、 La_2O_3 、 Y_2O_3 、 Yb_2O_3 、 Ta_2O_5 、 Nb_2O_5 および HfO_2 の合計含有量は $2 \sim 9\%$ とする。 ZrO_2 、 TiO_2 、 La_2O_3 、 Y_2O_3 、 Yb_2O_3 、 Ta_2O_5 、 Nb_2O_5 および HfO_2 の合計含有量の好ましい範囲は $2 \sim 8\%$ 、より好ましい範囲は $2 \sim 7\%$ 、さらに好ましい範囲は $2 \sim 6\%$ 、一層好ましい範囲は $2 \sim 5\%$ 、より一層好ましい範囲は $3 \sim 5\%$ である。

【0045】

ZrO_2 は、ガラス転移温度を高め耐熱性を改善する働きや、化学的耐久性、特に耐アルカリ性を改善する働きが大きく、また、ヤング率を高め高剛性化する効果も有する。したがって、 ZrO_2 、 TiO_2 、 La_2O_3 、 Y_2O_3 、 Yb_2O_3 、 Ta_2O_5 、 Nb_2O_5 および HfO_2 の合計含有量 ($\text{ZrO}_2 + \text{TiO}_2 + \text{La}_2\text{O}_3 + \text{Y}_2\text{O}_3 + \text{Yb}_2\text{O}_3 + \text{Ta}_2\text{O}_5 + \text{Nb}_2\text{O}_5 + \text{HfO}_2$) に対する ZrO_2 の含有量のモル比 ($\text{ZrO}_2 / (\text{ZrO}_2 + \text{TiO}_2 + \text{La}_2\text{O}_3 + \text{Y}_2\text{O}_3 + \text{Yb}_2\text{O}_3 + \text{Ta}_2\text{O}_5 + \text{Nb}_2\text{O}_5 + \text{HfO}_2)$) を $0.3 \sim 1$ とすることが好ましく、 $0.4 \sim 1$ とすることがより好ましく、 $0.5 \sim 1$ とすることがさらに好ましく、 $0.7 \sim 1$ とすることが一層好ましく、 $0.8 \sim 1$ とすることがより一層好ましく、 $0.9 \sim 1$ とすることがさらに一層好ましく、 $0.95 \sim 1$ とすることがなお一層好ましく、 1 とすることが特に好ましい。 ZrO_2 の含有量の好ましい範囲は $2 \sim 9\%$ 、より好ましい範囲は $2 \sim 8\%$ 、さらに好ましい範囲は $2 \sim 7\%$ 、一層好ましい範囲は $2 \sim 6\%$ 、より一層好ましい範囲は $2 \sim 5\%$ 、さらに一層好ましい範囲は $3 \sim 5\%$ である。

【0046】

TiO_2 は、上記成分中、比重の増大を抑える働きに優れるとともに、ヤング率、比弾性率を高める働きを有する。ただし、過剰に導入するとガラスを水に浸漬したときにガラス表面に水との反応生成物が付着しやすくなって耐水性が低下するため、 TiO_2 の含有量を $0 \sim 5\%$ の範囲にすることが好ましい。耐水性を良好に保つ上から、 TiO_2 の含有量の好ましい範囲は $0 \sim 4\%$ 、より好ましい範囲は $0 \sim 3\%$ 、さらに好ましい範囲は $0 \sim 2\%$ 、一層好ましい範囲は $0 \sim 1\%$ 、より一層好ましい範囲は $0 \sim 0.5\%$ である。なお、耐水性を一層改善する上から、 TiO_2 を実質的に含まないことが好ましい。

【0047】

La_2O_3 、 Y_2O_3 、 Yb_2O_3 、 Ta_2O_5 、 Nb_2O_5 、 HfO_2 は、比重を高める力が大

10

20

30

40

50

きいため、比重増大を抑える上から、それぞれの成分の含有量を0～4%の範囲にすることが好ましく、0～3%の範囲にすることがより好ましく、0～2%の範囲にすることがさらに好ましく、0～1%の範囲にすることが一層好ましく、0～0.5%の範囲にすることがより一層好ましい。 La_2O_3 、 Y_2O_3 、 Yb_2O_3 、 Ta_2O_5 、 Nb_2O_5 、 HfO_2 は、ガラス成分として導入しなくてもよい。

【0048】

その他、導入可能なガラス成分として、 B_2O_3 、 P_2O_5 などがある。

B_2O_3 は、脆さを低下させるとともに、熔融性を向上させる働きをするが、過剰導入により化学的耐久性が低下するため、その含有量の好ましい範囲は0～3%、より好ましい範囲は0～1%、さらに好ましい範囲は0～0.5%であり、導入しないことが一層好ましい。

10

P_2O_5 は、本発明の目的を損なわない範囲で少量導入することができるが、過剰導入により化学的耐久性が低下するため、その含有量を0～1%とすることが好ましく、0～0.5%とすることがより好ましく、0～0.3%とすることがさらに好ましく、導入しないことが一層好ましい。

【0049】

高耐熱性、高ヤング率、高熱膨張係数の3つの特性を同時に満たすガラスを得る上から、 SiO_2 、 Al_2O_3 、 Na_2O 、 K_2O 、 MgO 、 CaO 、 ZrO_2 、 TiO_2 、 La_2O_3 、 Y_2O_3 、 Yb_2O_3 、 Ta_2O_5 、 Nb_2O_5 および HfO_2 の合計含有量を95%以上とすることが好ましく、97%以上とすることがより好ましく、98%以上とすることがさらに好ましく、99%以上とすることが一層好ましく、100%としてもよい。

20

さらに、比重増大を抑える上から、 SiO_2 、 Al_2O_3 、 Na_2O 、 K_2O 、 MgO 、 CaO 、 ZrO_2 および TiO_2 の合計含有量を95%以上とすることが好ましく、97%以上とすることがより好ましく、98%以上とすることがさらに好ましく、99%以上とすることが一層好ましく、100%としてもよい。

さらに、耐水性を改善する上から、 SiO_2 、 Al_2O_3 、 Na_2O 、 K_2O 、 MgO 、 CaO および ZrO_2 の合計含有量を95%以上とすることが好ましく、97%以上とすることがより好ましく、98%以上とすることがさらに好ましく、99%以上とすることが一層好ましく、100%としてもよい。

【0050】

30

次に、任意成分であるSn酸化物およびCe酸化物について説明する。

Sn酸化物およびCe酸化物は、清澄剤として機能し得る成分である。Sn酸化物は、ガラス熔融時、高温で酸素ガスを放出し、ガラス中に含まれる微小な泡を取り込んで大きな泡にすることで浮上しやすくすることにより清澄を促す働きに優れている。一方、Ce酸化物は、低温でガラス中にガスとして存在する酸素をガラス成分として取り込むことにより泡を消す働きに優れている。泡の大きさ（固化したガラス中に残留する泡（空洞）の大きさ）が0.3mm以下の範囲で、Sn酸化物は比較的大きな泡も極小の泡も除く働きが強い。Sn酸化物とともにCe酸化物を添加すると、50 μm ～0.3mm程度の大きな泡の密度が数十分の一程度にまで激減する。このように、Sn酸化物とCe酸化物を共存させることにより、高温域から低温域にわたり広い温度範囲でガラスの清澄効果を高めることができるため、Sn酸化物およびCe酸化物を添加することが好ましい。

40

Sn酸化物およびCe酸化物の外割り添加量の合計が0.02質量%以上であれば、十分な清澄効果を期待することができる。微小かつ少量であっても未溶解物を含むガラスを用いて基板を作製すると、研磨によって基板表面に未溶解物が現れると、基板表面に突起が生じたり、未溶解物が欠落した部分が窪みとなって、基板表面の平滑性が損なわれ、磁気記録媒体基板としては使用できなくなる。これに対しSn酸化物およびCe酸化物の外割り添加量の合計が3.5質量%以下であれば、ガラス中に十分に溶解し得るため未溶解物の混入を防ぐことができる。

また、SnやCeは結晶化ガラスを作る場合には結晶核を生成する働きをする。本発明のガラスは非晶質性ガラスであるので、加熱によって結晶を析出しないことが望ましい。

50

S n、C eの量が過剰になると、こうした結晶の析出がおこりやすくなる。そのため、S n酸化物、C e酸化物とも過剰の添加は避けるべきである。

以上の観点から、S n酸化物およびC e酸化物の外割り添加量の合計を0.02～3.5質量%とすることが好ましい。S n酸化物とC e酸化物の外割り添加量の合計の好ましい範囲は0.1～2.5質量%、より好ましい範囲は0.1～1.5質量%、さらに好ましい範囲は0.5～1.5質量%である。

S n酸化物としては、S nO₂を用いることがガラス熔融中、高温で酸素ガスを効果的に放出する上から好ましい。

【0051】

なお、清澄剤として硫酸塩を外割りで0～1質量%の範囲で添加することもできるが、ガラス熔融中に熔融物が吹きこぼれるおそれがあり、ガラス中の異物が激増することから、硫酸塩を導入しないことが好ましい。

また、P b、C d、A sなどは環境に悪影響を与える物質なので、これらの導入も避けることが好ましい。

【0052】

以上の観点から本発明のガラスは、

S iO₂を50～75%、B₂O₃を0～3%、A l₂O₃を0～5%、L i₂Oを0～3%、N a₂Oを0～5%、K₂Oを1～10%、M gOを1～23%、C aOを6～21%、B aOを0～5%、Z nOを0～5%、T iO₂を0～5%、Z rO₂を2～9%含むことが好ましく、

S iO₂を50～75%、B₂O₃を0～1%、A l₂O₃を0～5%、L i₂Oを0～3%、N a₂Oを0～5%、K₂Oを1～9%、M gOを2～23%、C aOを6～21%、B aOを0～3%、Z nOを0～5%、T iO₂を0～3%、Z rO₂を3～7%含むことがより好ましい。

【0053】

本発明の磁気記録媒体基板用ガラスは、所定のガラス組成が得られるように酸化物、炭酸塩、硝酸塩、硫酸塩、水酸化物などのガラス原料を秤量、調合し、十分混合して、熔融容器内で、例えば1400～1600の範囲で加熱、熔融し、清澄、攪拌して十分泡切れがなされた均質化した熔融ガラスを成形することにより作製することができる。なお、必要に応じてガラス原料に前記した清澄剤を添加してもよい。

【0054】

以上説明した組成を有する本発明のガラスは、高い耐熱性、高剛性、高熱膨張係数という、同時に実現することが可能である。以下、本発明のガラスが有する好ましい物性について、順次説明する。

【0055】

1. 熱膨張係数

前述のとおり、磁気記録媒体基板を構成するガラスとHDDのスピンデル材料（例えば、ステンレスなど）の熱膨張係数の差が大きいと、HDDの動作時における温度変化によって磁気記録媒体が変形し、記録再生トラブルが起こるなど信頼性が低下することになってしまう。特に、高K_u磁性材料からなる磁気記録層を有する磁気記録媒体は、記録密度が極めて高いため、磁気記録媒体の僅かな変形によっても前記トラブルが起こりやすくなる。一般にHDDのスピンデル材料は、100～300の温度範囲において $70 \times 10^{-7}/$ 以上の平均線膨張係数（熱膨張係数）を有するものであるところ、本発明の磁気記録媒体基板用ガラスによれば、100～300の温度範囲における平均線膨張係数を $70 \times 10^{-7}/$ 以上にすることができ、上記信頼性を向上することができ、高K_u磁性材料からなる磁気記録層を有する磁気記録媒体に好適な基板を提供することができる。前記平均線膨張係数の好ましい範囲は $72 \times 10^{-7}/$ 以上、より好ましい範囲は $74 \times 10^{-7}/$ 以上、さらに好ましい範囲は $75 \times 10^{-7}/$ 以上、一層好ましい範囲は $77 \times 10^{-7}/$ 以上、より一層好ましい範囲は $78 \times 10^{-7}/$ 以上、さらに一層好ましい範囲は $79 \times 10^{-7}/$ 以上である。前記平均線膨張係数の上限は、スピンデル材料の熱膨張

特性を考慮すると、例えば $120 \times 10^{-7} /$ 程度であることが好ましく、 $100 \times 10^{-7} /$ であることがより好ましく、 $88 \times 10^{-7} /$ であることがさらに好ましい。

【0056】

2. ガラス転移温度

前述のとおり、高Ku磁性材料の導入などによって磁気記録媒体の高記録密度化を図る場合、磁性材料の高温処理などにおいて、磁気記録媒体基板は高温下に晒されることになる。その際、基板の極めて高い平坦性が損なわれないようにするため、磁気記録媒体基板用ガラスには優れた耐熱性を有することが求められる。耐熱性の指標としてはガラス転移温度を用いることができ、本発明の磁気記録媒体基板用ガラスによれば、ガラス転移温度を630 以上にすることができ、高温処理後にも優れた平坦性を維持することができる。したがって、本発明のガラスによれば、高Ku磁性材料を備えた磁気記録媒体の作製に好適な基板を提供することができる。

10

ガラス転移温度の好ましい範囲は640 以上、より好ましい範囲は650 以上、さらに好ましい範囲は655 以上、一層好ましい範囲は660 以上、より一層好ましい範囲は670 以上、さらに一層好ましい範囲は675 以上、なお一層好ましい範囲は680 以上であり、さらに685 以上、690 以上、695 以上、700 以上、705 以上、710 以上の順に下限が高温になるほど好ましい範囲となる。ガラス転移温度の上限は、例えば750 程度であるが特に限定されるものではない。

【0057】

3. ヤング率

20

磁気記録媒体の変形としては、HDDの温度変化による変形他、高速回転による変形がある。高速回転時の変形を抑制する上からは、磁気記録媒体基板用ガラスのヤング率を高めることが望まれる。本発明の磁気記録媒体基板用ガラスによれば、ヤング率を80 GPa以上にすることができ、高速回転時の基板変形を抑制し、高Ku磁性材料を備えた高記録密度化された磁気記録媒体においても、データの読み取り、書き込みを正確に行うことができる。

ヤング率の好ましい範囲は81 GPa以上、より好ましい範囲は82 GPa以上である。ヤング率の上限は、例えば95 GPa程度であるが特に限定されるものではない。

【0058】

磁気記録媒体基板用ガラスの上記熱膨張係数、ガラス転移温度、ヤング率はいずれも高Ku磁性材料を備えた高記録密度化された磁気記録媒体用のガラス基板に求められる重要な特性である。したがって、上記磁気記録媒体に好適な基板を提供する上で、 $100 \sim 300$ における平均線膨張係数が $70 \times 10^{-7} /$ 以上、ガラス転移温度が630 以上、ヤング率が80 GPa以上の特性をすべて一体的に備えた磁気記録媒体基板用ガラスが特に好ましい。本発明によれば、上記特性をすべて一体的に備えた磁気記録媒体基板用ガラスを提供することができる。

30

【0059】

4. 比弾性率・比重

磁気記録媒体を高速回転させたとき、変形しにくい基板を提供する上で、磁気記録媒体基板用ガラスの比弾性率を30 MNm/kg以上にすることが好ましい。その上限は、例えば35 MNm/kg程度であるが特に限定されるものではない。比弾性率はガラスのヤング率を密度で除したものである。ここで密度とはガラスの比重に、 g/cm^3 という単位を付けた量と考えればよい。ガラスの低比重化によって、比弾性率を大きくすることができるに加え、基板を軽量化することができる。基板の軽量化により、磁気記録媒体の軽量化がなされ、磁気記録媒体の回転に要する電力を減少させ、HDDの消費電力を抑えることができる。磁気記録媒体基板用ガラスの比重の好ましい範囲は3.0未満、より好ましい範囲は2.9以下、さらに好ましい範囲は2.85以下である。

40

【0060】

5. 耐酸性

磁気記録媒体基板を生産する際には、ガラスをディスク形状に加工し、主表面を極めて

50

平坦かつ平滑に加工する。そして、前記加工工程の後、通常、基板を酸洗浄して表面に付着した汚れである有機物を除去する。ここで基板を構成するガラスが耐酸性に劣るものとすると、上記酸洗浄時に面荒れを起こし、平坦性、平滑性が損なわれ磁気記録媒体基板として使用することが困難となる。特に基板表面の高い平坦性、平滑性が求められる高K_u磁性材料からなる磁気記録層を有する、高記録密度化された磁気記録媒体基板用のガラスは、優れた耐酸性を有することが望ましい。本発明のガラスは、耐酸性については、45

に保たれた1.7質量%の珪弗酸水溶液に浸漬した場合のエッチングレートが0.09 μm/分以下となる耐酸を実現することができる。また、酸洗浄に続いて、アルカリ洗浄して表面に付着した研磨剤などの異物を除去して一層清浄な状態の基板を得ることができる。アルカリ洗浄時にも面荒れによる基板表面の平坦性、平滑性の低下を防ぐ上から基板を構成するガラスが耐アルカリ性に優れたものであることが好ましい。耐アルカリ性については、50 に保たれた1質量%の水酸化カリウム水溶液に浸漬した場合のエッチングレートが0.09 nm/分以下となる耐アルカリ性を実現することができる。以下、上記エッチングレートにより評価される耐酸性、耐アルカリ性について説明する。

【0061】

ガラスを45 に保たれた1.7質量%の珪弗酸水溶液に浸漬するテストは、上記酸洗浄時にガラスが晒される環境または類似する環境に相当する。この条件におけるエッチングレートが0.09 μm/分より大きいと、平坦、平滑化した基板表面が酸洗浄によって荒れてしまい、基板表面の平坦性、平滑性が損なわれるおそれが生じる。そのため、磁気記録媒体基板用ガラスに上記耐酸性を付与することにより、酸洗浄による平坦性、平滑性の低下が極めて少ない基板を提供することができる。なお、磁気記録媒体基板用ガラスの耐酸性としてより好ましい範囲は、前記エッチングレートが0.07 μm/分以下であり、さらに好ましい範囲は0.06 μm/分以下であり、より一層好ましい範囲は0.05 μm/分以下である。

前記エッチングレートは単位時間あたりに削られるガラス表面の深さで表され、これは、上記珪弗酸水溶液に浸漬したときの試料の重量減少速度を、比重を用いて体積減少速度に換算し、ガラスの表面積で除して単位時間あたりのエッチング量を求めたものである。

【0062】

また、ガラスを50 に保たれた1質量%の水酸化カリウム水溶液に浸漬するテストは、上記アルカリ洗浄時にガラスが晒される環境または類似する環境に相当する。この条件におけるエッチングレートが0.09 nm/分以下のガラスであれば、アルカリ洗浄による平坦性、平滑性の低下が極めて少ない基板を提供することができる。なお、磁気記録媒体基板用ガラスの耐アルカリ性としてより好ましい範囲は、前記エッチングレートが0.08 nm/分以下となる範囲である。前記エッチングレートの測定法としては、前記した耐酸性のエッチングレートの測定法と同様の方法を用いることができる。

【0063】

6. 液相温度

ガラスを熔融し、得られた熔融ガラスを成形する際、成形温度が液相温度を下回るとガラスが結晶化し、均質なガラスが生産できない。そのためガラス成形温度は液相温度以上にする必要があるが、成形温度が1300 を超えると、例えば熔融ガラスをプレス成形する際に用いるプレス成形型が高温のガラスと反応して、ダメージを受けやすくなる。熔融ガラスを鋳型に鋳込んで成形する場合も同様に鋳型がダメージを受けやすくなる。また、Sn酸化物とCe酸化物による清澄効果が、成形温度の上昇に伴う清澄温度の上昇によって低下するおそれが生じる。こうした点に配慮し、液相温度を1300 以下にすることが好ましい。液相温度のより好ましい範囲は1250 以下、さらに好ましい範囲は1200 以下である。本発明のガラスによれば、上記好ましい範囲の液相温度を実現することができる。下限は特に限定されないが、800 以上を目安に考えればよい。

【0064】

7. 分光透過率

磁気記録媒体は、ガラス基板上に磁気記録層を含む多層膜を成膜する工程を経て生産さ

10

20

30

40

50

れる。現在、主流になっている枚葉式の成膜方式で基板上に多層膜を形成する際、例えばまず基板を成膜装置の基板加熱領域に導入しスパッタリングリングなどによる成膜が可能な温度にまで基板を加熱昇温する。基板の温度が十分昇温した後、基板を第1の成膜領域に移送し、基板上に多層膜の最下層に相当する膜を成膜する。次に基板を第2の成膜領域に移送し、最下層の上に成膜を行う。このように基板を後段の成膜領域に順次移送して成膜することにより、多層膜を形成する。上記加熱と成膜は真空ポンプにより排気された低圧下で行うため、基板の加熱は非接触方式を取らざるを得ない。そのため、基板の加熱には輻射による加熱が適している。この成膜は基板が成膜に好適な温度を下回らないうちに行う必要がある。各層の成膜に要する時間が長すぎると加熱した基板の温度が低下し、後段の成膜領域では十分な基板温度を得ることができないという問題が生じる。基板を長時間にわたって成膜可能な温度を保つためには、基板をより高温に加熱することが考えられるが、基板の加熱速度が小さいと加熱時間をより長くしなければならず、加熱領域に基板が滞在する時間も長くしなければならない。そのため各成膜領域における基板の滞在時間も長くなり、後段の成膜領域では十分な基板温度を保てなくなってしまう。さらにスループットを向上することも困難となる。特に高Ku磁性材料からなる磁気記録層を備えた磁気記録媒体を生産する場合、所定時間内に基板を高温に加熱するために、基板の輻射による加熱効率を一層高めるべきである。

10

SiO_2 、 Al_2O_3 を含むガラスには、波長2750～3700nmを含む領域に吸収ピークが存在する。また、後述する赤外線吸収剤を添加するか、ガラス成分として導入することにより、さらに短波長の輻射の吸収を高めることができ、波長700nm～3700nmの波長領域に吸収を持たせることができる。ガラス基板を輻射、すなわち、赤外線照射により効率よく加熱するには、上記波長域にスペクトルの極大が存在する赤外線を用いることが望まれる。加熱速度を上げるには、赤外線のスペクトル極大波長と基板の吸収ピーク波長をマッチさせるとともに赤外線パワーを増やすことが考えられる。赤外線源として高温状態のカーボンヒータを例にとると、赤外線のパワーを増加するにはカーボンヒータの入力を増加すればよい。しかし、カーボンヒータからの輻射を黒体輻射と考えると、入力増加によってヒータ温度が上昇するため、赤外線のスペクトルの極大波長が短波長側にシフトし、ガラスの上記吸収波長域から外れてしまう。そのため、基板の加熱速度を上げるためにはヒータの消費電力を過大にしなければならず、ヒータの寿命が短くなってしまうなどの問題が発生する。

20

30

このような点に鑑み、上記波長領域(波長700～3700nm)におけるガラスの吸収をより大きくすることにより、赤外線のスペクトル極大波長と基板の吸収ピーク波長を近づけた状態で赤外線の照射を行い、ヒータ入力を過剰にしないことが望ましい。そこで赤外線照射過熱効率を高めるため、磁気記録媒体基板用ガラスとしては、700～3700nmの波長域に、厚さ2mmに換算した分光透過率が50%以下となる領域が存在するか、または、前記波長域にわたり、厚さ2mmに換算した分光透過率が70%以下となる透過率特性を備えるガラスが好ましい。例えば、鉄、銅、コバルト、イッテルビウム、マンガン、ネオジム、プラセオジム、ニオブ、セリウム、バナジウム、クロム、ニッケル、モリブデン、ホルミウムおよびエルビウムの中から選ばれる少なくとも1種の金属の酸化物は、赤外線吸収剤として作用し得る。また、水分または水分に含まれるOH基は、3μm帯に強い吸収を有するため、水分も赤外線吸収剤として作用し得る。本発明のガラスに上記赤外線吸収剤として作用し得る成分を適量導入することにより、本発明のガラスに上記好ましい吸収特性を付与することができる。上記赤外線吸収剤として作用し得る酸化物の添加量は、酸化物として質量基準で500ppm～5%であることが好ましく、2000ppm～5%であることがより好ましく、2000ppm～2%であることがさらに好ましく、4000ppm～2%の範囲がより一層好ましい。また、水分については、 H_2O 換算の重量基準で200ppm超含まれることが好ましく、220ppm以上含まれることがより好ましい。

40

なお、 Yb_2O_3 、 Nb_2O_5 をガラス成分として導入する場合や清澄剤としてCe酸化物を添加する場合は、これら成分による赤外線吸収を基板加熱効率の向上に利用することが

50

できる。

【 0 0 6 5 】

[磁気記録媒体基板およびその製造方法]

本発明の磁気記録媒体基板は、本発明の磁気記録媒体基板用ガラスからなる。本発明の磁気記録媒体基板用ガラスによれば、高い耐熱性、高剛性、高熱膨張係数という3つの特性を兼ね備えたガラス基板を実現することができる。

【 0 0 6 6 】

更に本発明は、ガラス原料を加熱することにより熔融ガラスを調製し、該熔融ガラスをプレス成形法、ダウンドロー法またはフロート法のいずれかの方法により板状に成形し、得られた板状のガラスを加工する工程を経て本発明の磁気記録媒体基板を作製する磁気記録媒体基板の製造方法に関する。

【 0 0 6 7 】

プレス成形法では、流出する熔融ガラスを切断し、所要の熔融ガラス塊を得て、これをプレス成形型でプレス成形して薄肉円盤状の基板ブランクを作製する。

ダウンドロー法では、樋状の成形体を用いて熔融ガラスを導き、成形体の両側へと熔融ガラスをオーバーフローさせ、成形体の下方で成形体に沿って流下する2つの熔融ガラス流を合流させてから、下方に引っ張ってシート状に成形する。この方法はフュージョン法とも呼ばれ、成形体表面に接触したガラスの面を互いに張り合わせることにより、接触痕のないシートガラスを得ることができる。その後、得られたシート材から薄肉円盤状の基板ブランクがくり抜かれる。

フロート法では、溶融錫などを蓄えたフロートバス上に熔融ガラスを流し出し、引っ張りながらシート状ガラスに成形する。その後、得られたシート材から薄肉円盤状の基板ブランクがくり抜かれる。

このようにして得た基板ブランクに中心孔を設けたり、内外周加工、両主表面にラッピング、ポリッシングを施す。次いで、酸洗浄およびアルカリ洗浄を含む洗浄工程を経てディスク状の基板を得ることができる。

なお、本発明において「主表面」とは、基板の磁気記録層が設けられる面または設けられている面である。こうした面は、磁気記録媒体基板の表面のうち、最も面積の広い面であることから、主表面と呼ばれ、ディスク状の磁気記録媒体の場合、ディスクの円形状の表面（中心穴がある場合は中心穴を除く。）に相当する。

【 0 0 6 8 】

本発明の磁気記録媒体基板の一態様は、表面の一部または全部にイオン交換層を有する磁気記録媒体基板である。イオン交換層は、高温下、基板表面にアルカリ塩を接触させ、前記アルカリ塩中のアルカリ金属イオンと基板中のアルカリ金属イオンを交換させることにより形成することができる。通常のイオン交換は、アルカリ硝酸塩を加熱して熔融塩とし、この熔融塩に基板を浸漬して行う。例えば、硝酸カリウムの熔融塩中に磁気記録媒体基板を浸漬することにより、基板中のNaイオンと熔融塩中のKイオンが交換し、基板表面にイオン交換層が形成される。イオン交換により基板表面からのアルカリ溶出量を低減することができる。また、基板中のイオン半径の小さいアルカリ金属イオンに換えてイオン半径の大きいアルカリ金属イオンを導入すると、基板表面に圧縮応力層が形成される。これにより基板を化学強化することができる。

【 0 0 6 9 】

上記イオン交換層を有する磁気記録媒体基板を得るために、本発明のガラス中にガラス成分として含まれるアルカリ金属イオンとイオン交換によって交換するアルカリ金属イオンは、K、Rb、Csの各イオン、または、KイオンおよびRbイオンの組合わせ、KイオンとCsイオンの組合わせ、RbイオンとCsイオンの組合わせ、KイオンとRbイオンとCsイオンの組合わせであることが好ましい。なお、化学強化する場合は、イオン交換を、基板を構成するガラスの歪点より高温かつガラス転移温度より低温で、アルカリ溶融塩が熱分解しない温度範囲で行うことが好ましい。ガラス成分としてLi₂Oを含むガラスからなる基板をイオン交換する場合は、硝酸ナトリウム溶融塩を用いてもよい。

なお、基板がイオン交換層を有することは、ガラスの断面（イオン交換層を切る面）をバピネ法により観察して確認する方法、ガラス表面からアルカリ金属イオンの深さ方向の濃度分布を測定する方法等によって確認することができる。

【0070】

磁気記録媒体基板の耐衝撃性の指標としては、一般に抗折強度が用いられている。抗折強度は、図1に示すようにホルダー上に配置した基板の中心孔に鋼球を載せ、ロードセルによって荷重を加えていき、基板が破壊したときの荷重値として求めることができる。測定は、例えば抗折強度測定試験機（島津オートグラフDDS-2000）を用いて行うことができる。本発明のガラスによれば、例えば10kg以上、好ましくは15kg以上、さらに好ましくは20kg以上の抗折強度を有するガラス基板を提供することができる。

10

【0071】

本発明の基板は、例えば厚みが1.5mm以下、好ましくは1.2mm以下、より好ましくは1mm以下であり、下限は好ましくは0.3mmである。

【0072】

本発明の磁気記録媒体基板は、好ましくはディスク形状である。更に、主表面が下記（1）～（3）の表面性を有することが好ましい。

（1）原子間力顕微鏡を用いて $1\mu\text{m} \times 1\mu\text{m}$ の範囲で測定される表面粗さの算術平均Raが0.25nm以下；

（2） $5\mu\text{m} \times 5\mu\text{m}$ の範囲で測定される表面粗さの算術平均Raが0.15nm以下；

（3）波長 $100\mu\text{m} \sim 950\mu\text{m}$ における表面うねりの算術平均Waが0.5nm以下

20

。基板上に成膜する磁気記録層のグレインサイズは、例えば垂直記録方式では、10nm未満となっている。高記録密度化のため、ビットサイズが微細化されても、基板表面の表面粗さが大きいと、磁気特性の向上は見込めない。これに対し上記（1）、（2）の2種の表面粗さの算術平均Raを上記範囲の基板であれば、高記録密度化のためにビットサイズが微細化されても磁気特性の改善が可能である。また、上記（3）の表面うねりの算術平均Waを上記範囲にすることにより、HDDにおける磁気ヘッドの浮上安定性を向上させることができる。上記（1）～（3）の表面性を兼ね備えた基板を実現する上で、前述の本発明のガラスの耐酸性、耐アルカリ性は有効である。

【0073】

30

[磁気記録媒体]

本発明の磁気記録媒体は、本発明の基板上に磁気記録層を有する磁気記録媒体である。

磁気記録媒体は磁気ディスク、ハードディスクなどと呼ばれ、デスクトップパソコン、サーバ用コンピュータ、ノート型パソコン、モバイル型パソコンなどの内部記憶装置（固定ディスクなど）、画像および/または音声を記録再生する携帯記録再生装置の内部記憶装置、車載オーディオの記録再生装置などに好適である。

磁気記録媒体は、例えば基板の主表面上に、前記主表面に近いほうから順に、少なくとも付着層、下地層、磁性層（磁気記録層）、保護層、潤滑層が積層された構成になっている。

例えば基板を真空引きを行った成膜装置内に導入し、DCマグネトロンスパッタリング法にてAr雰囲気中で、基板主表面上に付着層から磁性層まで順次成膜する。付着層としては例えばCrTi、下地層としては例えばCrRuを用いることができる。上記成膜後、例えばCVD法により C_2H_4 を用いて保護層を成膜し、同一チャンバ内で、表面に窒素を導入する窒化処理を行うことにより、磁気記録媒体を形成することができる。その後、例えばPFPE（ポリフルオロポリエーテル）をディップコート法により保護層上に塗布することにより、潤滑層を形成することができる。

40

【0074】

先に説明したように、磁気記録媒体のより一層の高密度記録化のためには、高Ku磁性材料から磁気記録層を形成することが好ましい。この点から好ましい磁性材料としては、Fe-Pt系磁性材料またはCo-Pt系磁性材料を挙げることができる。なおここで「

50

系」とは、含有することを意味する。即ち、本発明の磁気記録媒体は、磁気記録層として Fe および Pt、または Co および Pt を含む磁気記録層を有することが好ましい。例えば Co - Cr 系等の従来汎用されていた磁性材料の成膜温度が 250 ~ 300 程度であるのに対し、Fe - Pt 系磁性材料、Co - Pt 系磁性材料の成膜温度は通常 500 超の高温である。更にこれら磁性材料は、通常、成膜後に結晶配向性を揃えるため、成膜温度を超える温度で高温の熱処理（アニール）が施される。したがって、Fe - Pt 系磁性材料または Co - Pt 系磁性材料を用いて磁気記録層を形成する際には基板が上記高温に晒されることとなる。ここで基板を構成するガラスが耐熱性に乏しいものであると、高温下で変形し平坦性が損なわれる。これに対し本発明の磁気記録媒体に含まれる基板は、本発明のガラスからなり優れた耐熱性を示し得るものであるため、Fe - Pt 系磁性材料または Co - Pt 系磁性材料を用いて磁気記録層を形成した後も、高い平坦性を維持することができる。上記磁気記録層は、例えば、Ar 雰囲気中、Fe - Pt 系磁性材料または Co - Pt 系磁性材料を DC マグネトロンスパッタリング法にて成膜し、次いで加熱炉内により高温での熱処理を施すことにより形成することができる。

【0075】

ところで、Ku（結晶磁気異方性エネルギー定数）は保磁力 Hc に比例する。保磁力 Hc とは、磁化の反転する磁界の強さを表す。先に説明したように、高 Ku 磁性材料は熱揺らぎに対して耐性を有するため、磁性粒子を微粒化しても熱揺らぎによる磁化領域の劣化が起こりにくく高密度記録化に好適な材料として知られている。しかし上記の通り Ku と Hc は比例関係にあるため、Ku を高めるほど Hc も高まり、即ち磁気ヘッドによる磁化の反転が起こりにくくなり情報の書き込みが困難となる。そこで、記録ヘッドによる情報の書き込み時にヘッドからデータ書き込み領域に瞬間的にエネルギーを加え、保磁力を低下させることで高 Ku 磁性材料の磁化反転をアシストする記録方式が近年注目を集めている。このような記録方式は、エネルギーアシスト記録方式と呼ばれ、中でもレーザー光の照射により磁化反転をアシストする記録方式は熱アシスト記録方式、マイクロ波によりアシストする記録方式はマイクロ波アシスト記録方式と呼ばれる。前述のように、本発明によれば高 Ku 磁性材料による磁気記録層の形成が可能となるため、高 Ku 磁性材料とエネルギーアシスト記録の組み合わせにより、例えば面記録密度が 1 テラバイト / inch² を超える高密度記録を実現することができる。なお、熱アシスト記録方式については、例えば IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, VOL. 44, No. 1, JANUARY 2008 119 に、マイクロ波アシスト記録方式については、例えば IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, VOL. 44, No. 1, JANUARY 2008 125 に、それぞれ詳細に記載されており、本発明においてもこれら文献記載の方法により、エネルギーアシスト記録を行うことができる。

【0076】

本発明の磁気記録媒体基板（例えば磁気ディスク基板）、磁気記録媒体（例えば磁気ディスク）とも、その寸法に特に制限はないが、高記録密度化が可能であるため媒体および基板を小型化することができる。例えば、公称直径 2.5 インチは勿論、更に小径（例えば 1 インチ）の磁気ディスク基板または磁気ディスクとして好適である。

【実施例】

【0077】

以下に、本発明を実施例により更に詳細に説明する。但し、本発明は実施例に示す態様に限定されるものではない。

【0078】

（１）熔融ガラスの作製

表 1 に示す組成のガラスが得られるように酸化物、炭酸塩、硝酸塩、水酸化物などの原料を秤量し、混合して調合原料とした。この原料を熔融容器に投入して 1400 ~ 1600 の範囲で 6 時間、加熱、熔融し、清澄、攪拌して泡、未溶解物を含まない均質な熔融ガラスを作製した。得られたガラス中には泡や未溶解物、結晶の析出、熔融容器を構成する耐火物や白金の混入物は認められなかった。

【0079】

(2) 基板ブランクの作製

次に、下記方法 A または B により、円盤状の基板ブランクを作製した。

(方法 A)

清澄、均質化した上記熔融ガラスをパイプから一定流量で流出するとともにプレス成形用の下型で受け、下型上に所定量の熔融ガラス塊が得られるよう流出した熔融ガラスを切断刃で切断した。そして熔融ガラス塊を載せた下型をパイプ下方から直ちに搬出し、下型と対向する上型および胴型を用いて、直径 66 mm、厚さ 2 mm の薄肉円盤状にプレス成形した。プレス成形品を变形しない温度にまで冷却した後、型から取り出してアニールし、基板ブランクを得た。なお、上記成形では複数の下型を用いて流出する熔融ガラスを次々に円盤形状の基板ブランクに成形した。

10

(方法 B)

清澄、均質化した上記熔融ガラスを円筒状の貫通孔が設けられた耐熱性鋳型の貫通孔に上部から連続的に鋳込み、円柱状に成形して貫通孔の下側から取り出した。取り出したガラスをアニールした後、マルチワイヤーソーを用いて円柱軸に垂直な方向に一定間隔でガラスをスライス加工し、円盤状の基板ブランクを作製した。

なお、本実施例では上記方法 A、B を採用したが、円盤状の基板ブランクの製造方法としては、下記方法 C、D も好適である。

(方法 C)

上記熔融ガラスをフロートバス上に流し出し、シート状のガラスに成形（フロート法による成形）し、次いでアニールした後にシートガラスから円盤状のガラスをくり貫いて基板ブランクを得ることもできる。

20

(方法 D)

上記熔融ガラスをオーバーフローダウンドロー法（フュージョン法）によりシート状のガラスに成形、アニールし、次いでシートガラスから円盤状のガラスをくり貫いて基板ブランクを得ることもできる。

【0080】

(3) 基板の作製

上記各方法で得られた基板ブランクの中心に貫通孔をあけて、外周、内周の研削加工を行い、円盤の主表面をラッピング、ポリッシング（鏡面研磨加工）して直径 65 mm、厚さ 0.7 mm の磁気ディスク用基板に仕上げた。得られた基板は、1.7 質量%の珪弗酸（ H_2SiF_6 ）水溶液次いで、1 質量%の水酸化カリウム水溶液を用いて洗浄し、次いで純水ですすいだ後に乾燥させた。実施例のガラスから作製した基板の表面を拡大観察したところ、表面荒れなどは認められず、平滑な表面であった。

30

下記(4)では、上記の方法で作製したディスク状の基板をそのまま磁気ディスクの作製に使用した。これとは別に、上記と同様の方法で作製したディスク状の基板を硝酸カリウムの溶融塩に浸漬し、イオン交換によって表面にイオン交換層を有する基板を得た。このようにイオン交換処理を施すことは、抗折強度を高めるために有効である。イオン交換処理を施した複数枚の基板から、サンプリングした基板の断面（イオン交換層を切る面）をバビネ法により観察し、イオン交換層が形成されていることを確認した。イオン交換処理後の各基板の抗折強度を前述の方法で測定したところ、20 kg 以上の値を示した。このようにイオン交換処理を施したディスク状基板を用いて磁気ディスクを作製することもできる。

40

以上の例では、カリウム化合物の溶融塩に基板を浸漬してイオン交換層を有する基板を作製したが、カリウム化合物の溶融塩に代えて、

- (A) カリウム化合物とルビジウム化合物の混合溶融塩、
- (B) カリウム化合物とセシウム化合物の混合溶融塩、
- (C) ルビジウム化合物とセシウム化合物の混合溶融塩、
- (D) カリウム化合物、ルビジウム化合物およびセシウム化合物の混合溶融塩、
- (E) ルビジウム化合物の溶融塩、
- (F) セシウム化合物の溶融塩、

50

のいずれかに基板を浸漬してイオン交換処理を行いイオン交換層を形成することもできる。上記熔融塩としては、例えば硝酸塩を用いることができる。また、イオン交換層は基板表面の全域に形成してもよいし、外周面のみに形成してもよいし、外周面と内周面のみに形成してもよい。

【0081】

(4) 磁気ディスクの作製

以下の方法により、実施例のガラスから得られたガラス基板の主表面上に、付着層、下地層、磁性層、保護層、潤滑層をこの順に形成し、磁気ディスクを得た。

【0082】

まず、真空引きを行った成膜装置を用いて、DCマグネトロンスパッタリング法にて、Ar雰囲気中で、付着層、下地層および磁性層を順次成膜した。

10

【0083】

このとき、付着層は、厚さ20nmのアモルファスCrTi層となるように、CrTiターゲットを用いて成膜した。続いて枚葉・静止対向型成膜装置を用いて、Ar雰囲気中で、DCマグネトロンスパッタリング法にて下地層としてアモルファスCrRuからなる10nm厚の層を形成した。また、磁性層は、厚さ200nmのアモルファスFePtまたはCoPt層となるように、FePtまたはCoPtターゲットを用いて成膜温度400にて成膜した。

【0084】

磁性層までの成膜を終えた磁気ディスクを成膜装置から加熱炉内に移し、650～700の温度でアニールした。

20

【0085】

続いて、エチレンを材料ガスとしたCVD法により水素化カーボンからなる保護層を形成した。この後、PFPE（パーフロロポリエーテル）を用いてなる潤滑層をディップコート法により形成した。潤滑層の膜厚は1nmであった。

以上の製造工程により、磁気ディスクを得た。

【0086】

1. ガラスの評価

(1) ガラス転移温度 T_g 、熱膨張係数

各ガラスのガラス転移温度 T_g および100～300における平均線膨張係数を、熱機械分析装置(TMA)を用いて測定した。

30

(2) ヤング率

各ガラスのヤング率を超音波法にて測定した。

(3) 比重

各ガラスの比重をアルキメデス法にて測定した。

(4) 比弾性率

上記(2)で得られたヤング率および(3)で得られた比重から、比弾性率を算出した。

(5) 耐酸性

実施例1～11、13～20、比較例1、2の各ガラスから上記と同様の方法で基板を作製した。作製された基板の一部に、エッチングされない部分を作るためにマスク処理を施し、その状態のガラス基板を45に維持した1.7質量%ケイフッ酸水溶液に所定時間浸漬した。その後、ガラス基板を上記各水溶液から引き上げ、マスク処理を施した部分と施していない部分との差分(エッチングの差)を求め、浸漬時間で割ることにより、単位時間あたりのエッチング量(エッチングレート)を求めた。

40

(6) 液相温度

白金ルツボにガラス試料を入れ、所定温度にて2時間保持し、炉から取り出し冷却後、結晶析出の有無を顕微鏡により観察し、結晶の認められない最低温度を液相温度(L.T.)とした。

以上の結果を表1に示す。

50

【 0 0 8 7 】

2. 基板の評価（表面粗さ、表面うねり）

実施例の各基板の主表面（磁気記録層等を積層する面）の $5\ \mu\text{m} \times 5\ \mu\text{m}$ の矩形領域を原子間力顕微鏡（AFM）により観察し、 $1\ \mu\text{m} \times 1\ \mu\text{m}$ の範囲で測定される表面粗さの算術平均 R_a 、 $5\ \mu\text{m} \times 5\ \mu\text{m}$ の範囲で測定される表面粗さの算術平均 R_a 、波長 $100\ \mu\text{m} \sim 950\ \mu\text{m}$ における表面うねりの算術平均 W_a を測定した。

いずれの実施例のガラス基板についても、 $1\ \mu\text{m} \times 1\ \mu\text{m}$ の範囲で測定される表面粗さの算術平均 R_a が $0.15 \sim 0.25\ \text{nm}$ の範囲、 $5\ \mu\text{m} \times 5\ \mu\text{m}$ の範囲で測定される表面粗さの算術平均 R_a が $0.12 \sim 0.15\ \text{nm}$ の範囲、波長 $100\ \mu\text{m} \sim 950\ \mu\text{m}$ における表面うねりの算術平均 W_a が $0.4 \sim 0.5\ \text{nm}$ であり、磁気記録媒体に用いられ

10

【 0 0 8 8 】

【表 1】

		実施例1		実施例2		実施例3		実施例4		実施例5	
		モル%	質量%	モル%	質量%	モル%	質量%	モル%	質量%	モル%	質量%
組成	SiO ₂	66.2	62.4	62.0	59.8	65.4	61.2	60.2	59.4	64.8	60.8
	Al ₂ O ₃	0.5	0.8	0.4	0.7	0.4	0.6	0.4	0.7	0.4	0.7
	B ₂ O ₃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Li ₂ O	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Na ₂ O	3.3	3.2	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	3.3	1.1	1.1
	K ₂ O	6.2	9.2	4.4	6.6	6.2	9.1	3.3	5.1	7.8	11.4
	Cs ₂ O	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	MgO	6.5	4.1	9.6	6.2	6.5	4.1	11.7	7.8	7.5	4.8
	CaO	12.5	11.0	15.6	14.0	12.5	10.9	17.5	16.2	13.6	11.9
	SrO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	BaO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ZnO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ZrO ₂	4.8	9.3	4.8	9.5	5.7	10.9	3.7	7.5	4.8	9.3
	TiO ₂	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	La ₂ O ₃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y ₂ O ₃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Yb ₂ O ₃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ta ₂ O ₅	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Nb ₂ O ₅	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	HfO ₂	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	SiO ₂ +Al ₂ O ₃ +B ₂ O ₃	66.7	63.2	62.4	60.5	65.8	61.8	60.6	60.1	65.2	61.5
	Li ₂ O+Na ₂ O+K ₂ O+Cs ₂ O	9.5	12.4	7.6	9.8	9.5	12.3	6.5	8.4	8.9	12.5
	Na ₂ O+K ₂ O	9.5	12.4	7.6	9.8	9.5	12.3	6.5	8.4	8.9	12.5
	(Na ₂ O+K ₂ O)/(Li ₂ O+Na ₂ O+K ₂ O+Cs ₂ O)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	MgO+CaO+SrO+BaO	19.0	15.1	25.2	20.2	19.0	15.0	29.2	24.0	21.1	16.7
	MgO+CaO	19.0	15.1	25.2	20.2	19.0	15.0	29.2	24.0	21.1	16.7
	SrO+BaO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(MgO+CaO)/(MgO+CaO+SrO+BaO)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	Al ₂ O ₃ /(MgO+CaO)	0.026	0.065	0.016	0.071	0.021	0.049	0.014	0.083	0.019	0.056
	Al ₂ O ₃ /CaO	0.040	0.073	0.026	0.050	0.032	0.055	0.023	0.043	0.029	0.059
	A _m O _n	4.8	9.3	4.8	9.5	5.7	10.9	3.7	7.5	4.8	9.3
	ZrO ₂ /A _m O _n	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
特性	比重	2.7		2.8		2.7		2.8		2.7	
	ガラス転移温度T _g [°C]	667		692		698		690		710	
	平均線膨張係数[×10 ⁻⁷ /°C]	79		80		79		80		75	
	ヤング率[GPa]	82		88		85		90		84	
	比弾性率[MNm/kg]	30.4		31		31		32		31	
	液相温度LT[°C]	1180		1220		1200		1300未満		1250	
	エッチングレート[μm/分]	0.03		0.03		0.03		0.03		0.03	

(注) A_mO_nは、ZrO₂、TiO₂、La₂O₃、Y₂O₃、Yb₂O₃、Ta₂O₅、Nb₂O₅およびHfO₂の合計含有量を意味する。

10

20

30

40

		実施例6		実施例7		実施例8		実施例9		実施例10	
		モル%	質量%	モル%	質量%	モル%	質量%	モル%	質量%	モル%	質量%
組成	SiO ₂	63.6	59.5	57.6	55.9	65.5	61.8	65.9	62.0	64.1	60.0
	Al ₂ O ₃	0.4	0.7	2.1	3.5	0.4	0.6	0.9	1.4	0.4	0.7
	B ₂ O ₃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Li ₂ O	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Na ₂ O	4.3	4.1	3.2	3.2	4.4	4.3	3.3	3.2	3.3	3.2
	K ₂ O	1.1	1.6	2.8	4.3	6.1	9.0	6.1	9.0	6.2	9.0
	Cs ₂ O	1.1	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	MgO	5.2	3.3	11.8	7.7	6.4	4.1	6.5	4.1	6.5	4.1
	CaO	19.6	17.1	17.7	16.0	12.4	10.9	12.5	11.0	12.5	11.0
	SrO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	BaO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ZnO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ZrO ₂	4.7	9.0	4.8	9.5	4.8	9.3	4.8	9.3	4.8	9.3
	TiO ₂	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.7
	La ₂ O ₃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y ₂ O ₃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Yb ₂ O ₃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ta ₂ O ₅	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Nb ₂ O ₅	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	HfO ₂	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合計	100.0	100.0	100.0	100.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	SiO ₂ +Al ₂ O ₃ +B ₂ O ₃	64.0	60.2	59.7	59.4	65.9	62.4	66.8	63.4	64.5	60.7
	Li ₂ O+Na ₂ O+K ₂ O+Cs ₂ O	6.5	10.4	6.0	7.5	10.5	13.3	9.4	12.2	9.5	12.2
	Na ₂ O+K ₂ O	5.4	5.7	6.0	7.5	10.5	13.3	9.4	12.2	9.5	12.2
	(Na ₂ O+K ₂ O)/(Li ₂ O+Na ₂ O+K ₂ O+Cs ₂ O)	0.8	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	MgO+CaO+SrO+BaO	24.8	20.4	29.5	23.7	18.8	15.0	19.0	15.1	19.0	15.1
	MgO+CaO	24.8	20.4	29.5	23.7	18.8	15.0	19.0	15.1	19.0	15.1
	SrO+BaO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(MgO+CaO)/(MgO+CaO+SrO+BaO)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	Al ₂ O ₃ /(MgO+CaO)	0.016	0.123	0.071	0.467	0.021	0.048	0.047	0.115	0.021	0.057
	Al ₂ O ₃ /CaO	0.020	0.041	0.119	0.219	0.032	0.059	0.072	0.127	0.032	0.064
	A _m O _n	4.7	9.0	4.8	9.5	4.8	9.3	4.8	9.3	7.0	12.0
	ZrO ₂ /A _m O _n	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.8
特性	比重	2.8		2.8		2.7		2.7		2.7	
	ガラス転移温度T _g [°C]	701		701		670		689		686	
	平均線膨張係数[×10 ⁻⁷ /°C]	75		79		83		78		74.6	
	ヤング率[GPa]	90		93		83		84		85	
	比弾性率[MNm/kg]	32		33		31		31		31	
	液相温度LT[°C]	1290未満		1300超		1220		1220		1180	
	エッチングレート[μm/分]	0.03		0.07		0.03		0.03		0.03	

(注) A_mO_nは、ZrO₂、TiO₂、La₂O₃、Y₂O₃、Yb₂O₃、Ta₂O₅、Nb₂O₅およびHfO₂の合計含有量を意味する。

10

20

30

40

		実施例11		実施例12		実施例13		実施例14		実施例15	
		モル%	質量%	モル%	質量%	モル%	質量%	モル%	質量%	モル%	質量%
組成	SiO ₂	67.7	59.4	67.7	58.8	59.7	58.7	64.8	60.6	57.9	52.8
	Al ₂ O ₃	0.5	0.7	0.5	0.7	0.0	0.0	0.4	0.7	0.4	0.7
	B ₂ O ₃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Li ₂ O	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Na ₂ O	3.4	3.1	3.4	3.0	3.2	3.2	0.0	0.0	3.1	3.0
	K ₂ O	6.3	8.7	6.3	8.5	3.3	5.1	8.9	13.0	3.3	4.7
	Cs ₂ O	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	MgO	2.1	1.3	2.1	1.2	11.6	7.6	7.5	4.7	8.3	5.1
	CaO	12.8	10.5	12.8	10.4	17.5	16.0	13.6	11.8	16.1	13.7
	SrO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	BaO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.9
	ZnO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ZrO ₂	4.9	8.9	4.9	8.8	4.7	9.4	4.8	9.2	6.7	12.6
	TiO ₂	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.5
	La ₂ O ₃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y ₂ O ₃	2.3	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Yb ₂ O ₃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ta ₂ O ₅	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Nb ₂ O ₅	0.0	0.0	2.3	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	HfO ₂	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	SiO ₂ +Al ₂ O ₃ +B ₂ O ₃	68.2	60.1	68.2	59.5	59.7	58.7	65.2	61.3	58.3	53.5
	Li ₂ O+Na ₂ O+K ₂ O+Cs ₂ O	9.7	11.8	9.7	11.5	6.5	8.3	8.9	13.0	6.4	7.7
	Na ₂ O+K ₂ O	9.7	11.8	9.7	11.5	6.5	8.3	8.9	13.0	6.4	7.7
	(Na ₂ O+K ₂ O)/(Li ₂ O+Na ₂ O+K ₂ O+Cs ₂ O)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	MgO+CaO+SrO+BaO	14.9	11.8	14.9	11.6	29.1	23.6	21.1	16.5	26.5	23.7
	MgO+CaO	14.9	11.8	14.9	11.6	29.1	23.6	21.1	16.5	24.4	18.8
	SrO+BaO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.9
	(MgO+CaO)/(MgO+CaO+SrO+BaO)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.92	0.79
	Al ₂ O ₃ /(MgO+CaO)	0.034	0.059	0.034	0.061	0.000	0.000	0.019	0.054	0.016	0.091
	Al ₂ O ₃ /CaO	0.039	0.067	0.039	0.067	0.000	0.000	0.029	0.059	0.025	0.051
	A _m O _n	7.2	16.3	7.2	17.4	4.7	9.4	4.8	9.2	8.8	15.1
	ZrO ₂ /A _m O _n	0.7	0.5	0.7	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8
特性	比重	2.8		2.8		2.8		2.7		2.95	
	ガラス転移温度T _g [°C]	716		710		696		727		708	
	平均線膨張係数[×10 ⁻⁷ /°C]	77.1		75.7		76.6		77.2		75.5	
	ヤング率[GPa]	86		85		88		80		94	
	比弾性率[MNm/kg]	31		30		31.6		30		32	
	液相温度LT[°C]	1200未満		1200未満		1300未満		1300未満		1300超	
	エッチングレート[μm/分]	0.03		-		0.04		0.03		0.06	

(注) A_mO_nは、ZrO₂、TiO₂、La₂O₃、Y₂O₃、Yb₂O₃、Ta₂O₅、Nb₂O₅およびHfO₂の合計含有量を意味する。

		実施例16		実施例17		実施例18		実施例19		実施例20	
		モル%	質量%	モル%	質量%	モル%	質量%	モル%	質量%	モル%	質量%
組成	SiO ₂	71.3	67.0	65.3	61.4	59.2	56.6	68.3	63.2	67.8	62.4
	Al ₂ O ₃	0.4	0.7	0.4	0.7	0.4	0.7	0.4	0.7	2.7	4.2
	B ₂ O ₃	0.0	0.0	0.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Li ₂ O	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0
	Na ₂ O	3.3	3.2	3.3	3.2	3.2	3.2	4.4	4.3	4.5	4.3
	K ₂ O	6.2	9.1	6.2	9.2	3.3	5.0	4.5	6.7	5.2	7.5
	Cs ₂ O	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	MgO	6.5	4.1	6.5	4.1	9.5	6.1	6.5	4.2	2.1	1.3
	CaO	7.5	6.6	12.6	11.1	15.4	13.7	12.5	11.1	12.8	11.0
	SrO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	BaO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ZnO	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	ZrO ₂	4.8	9.3	4.9	9.4	4.7	9.2	4.8	9.5	4.9	9.3
	TiO ₂	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	La ₂ O ₃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y ₂ O ₃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Yb ₂ O ₃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ta ₂ O ₅	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Nb ₂ O ₅	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	HfO ₂	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	SiO ₂ +Al ₂ O ₃ +B ₂ O ₃	71.7	67.7	66.5	63.0	59.6	57.3	66.7	63.9	70.5	66.6
	Li ₂ O+Na ₂ O+K ₂ O+Cs ₂ O	9.5	12.3	9.5	12.4	6.5	8.2	9.5	11.3	9.7	11.8
	Na ₂ O+K ₂ O	9.5	12.3	9.5	12.4	6.5	8.2	8.9	11.0	9.7	11.8
	(Na ₂ O+K ₂ O)/(Li ₂ O+Na ₂ O+K ₂ O+Cs ₂ O)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0
	MgO+CaO+SrO+BaO	14.0	10.7	19.1	15.2	24.9	19.8	19.0	15.3	14.9	12.3
	MgO+CaO	14.0	10.7	19.1	15.2	24.9	19.8	19.0	15.3	14.9	12.3
	SrO+BaO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(MgO+CaO)/(MgO+CaO+SrO+BaO)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	Al ₂ O ₃ /(MgO+CaO)	0.029	0.057	0.021	0.056	0.016	0.085	0.021	0.064	0.181	0.356
	Al ₂ O ₃ /CaO	0.053	0.106	0.032	0.063	0.026	0.051	0.032	0.063	0.211	0.382
	A _m O _n	4.8	9.3	4.9	9.4	4.7	9.2	4.8	9.5	4.9	9.3
	ZrO ₂ /A _m O _n	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
特性	比重	2.6		2.7		2.9		2.7		2.7	
	ガラス転移温度T _g [°C]	692		675		678		662		700	
	平均線膨張係数[×10 ⁻⁷ /°C]	73.3		77.8		74.7		80		78.3	
	ヤング率[GPa]	80		83		91		86		83	
	比弾性率[MNm/kg]	30		31		32		32		31	
	液相温度LT[°C]	1300未満		1180		1300未満		1130		1200未満	
	エッチングレート[μm/分]	0.03		0.03		0.03		0.03		0.03	

(注) A_mO_nは、ZrO₂、TiO₂、La₂O₃、Y₂O₃、Yb₂O₃、Ta₂O₅、Nb₂O₅およびHfO₂の合計含有量を意味する。

10

20

30

40

		比較例1		比較例2	
		モル%	質量%	モル%	質量%
組成	SiO ₂	60.3	49.3	64.6	56.7
	Al ₂ O ₃	5	6.9	8.4	12.5
	B ₂ O ₃	0.0	0.0	0.0	0.0
	Li ₂ O	0.0	0.0	0.0	0.0
	Na ₂ O	0.0	0.0	14.8	13.4
	K ₂ O	8.0	10.3	2.7	3.7
	Cs ₂ O	0.0	0.0	0.0	0.0
	MgO	1.0	0.6	2.0	1.2
	CaO	15.0	11.5	2.0	1.6
	SrO	0.0	0.0	0.0	0.0
	BaO	8.0	16.8	2.5	5.6
	ZnO	0.0	0.0	0.0	0.0
	ZrO ₂	2.7	4.6	3.0	5.3
	TiO ₂	0.0	0.0	0.0	0.0
	La ₂ O ₃	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y ₂ O ₃	0.0	0.0	0.0	0.0
	Yb ₂ O ₃	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ta ₂ O ₅	0.0	0.0	0.0	0.0
	Nb ₂ O ₅	0.0	0.0	0.0	0.0
	HfO ₂	0.0	0.0	0.0	0.0
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0
	SiO ₂ +Al ₂ O ₃ +B ₂ O ₃	65.3	56.2	73.0	69.2
	Li ₂ O+Na ₂ O+K ₂ O+Cs ₂ O	8.0	10.3	17.5	17.1
	Na ₂ O+K ₂ O	8.0	10.3	17.5	17.1
	(Na ₂ O+K ₂ O)/(Li ₂ O+Na ₂ O+K ₂ O+Cs ₂ O)	1.0	1.0	1.0	1.0
	MgO+CaO+SrO+BaO	24.0	28.9	6.5	8.4
	MgO+CaO	16.0	12.1	4.0	2.8
	SrO+BaO	8.0	16.8	2.5	5.6
	(MgO+CaO)/(MgO+CaO+SrO+BaO)	0.67	0.42	0.62	0.33
	Al ₂ O ₃ /(MgO+CaO)	0.313	0.670	2.100	0.731
	Al ₂ O ₃ /CaO	0.333	0.600	4.200	7.813
	A _m O _n	2.7	4.6	3.0	5.3
	ZrO ₂ /A _m O _n	1.0	1.0	1.0	1.0
特性	比重	3.0		2.7	
	ガラス転移温度T _g [°C]	729		607	
	平均線膨張係数[×10 ⁻⁷ /°C]	83.2		97.4	
	ヤング率[GPa]	79		77	
	比弾性率[MNm/kg]	27		29	
	液相温度LT[°C]	1250		1000	
	エッチングレート[μm/分]	1.17		0.25	

(注)A_mO_nは、ZrO₂、TiO₂、La₂O₃、Y₂O₃、Yb₂O₃、Ta₂O₅、Nb₂O₅およびHfO₂の合計含有量を意味する。

【0089】

表1に示すように、実施例のガラスは、高い耐熱性（高いガラス転移温度）、高剛性（高いヤング率）、高熱膨張係数という、磁気記録媒体基板に求められる3つの特性を兼ね備えたものであった。更に表1の結果から、実施例のガラスは、高速回転に耐え得る高い比弾性率を有し、かつ低比重であり基板の軽量化も可能であること、磁気記録媒体に求められる高い耐酸性を有することも確認できる。

これに対し、比較例1、2のガラスは、ヤング率、比弾性率とも低く、磁気記録媒体基板に求められる特性を備えていないものであった。これは主に、モル比[(MgO+CaO)/(MgO+CaO+SrO+BaO)]が0.85に満たないことと、モル比[Al₂O₃/(MgO+CaO)]が0.30を超えることによるものである。

以上の結果から、本発明によれば、磁気記録媒体基板に求められる特性を兼ね備えたガラスが得られることが確認された。

【 0 0 9 0 】

3 . 磁気ディスクの評価

(1) 平坦性

一般に、平坦度が $5\ \mu\text{m}$ 以下であれば信頼性の高い記録再生を行うことができる。上記方法で実施例の基板を用いて形成した各磁気ディスク表面の平坦度（ディスク表面の最も高い部分と、最も低い部分との上下方向（表面に垂直な方向）の距離（高低差））を、平坦度測定装置で測定したところ、いずれの磁気ディスクも平坦度は $5\ \mu\text{m}$ 以下であった。この結果から、実施例のガラス基板は、FePt層またはCoPt層形成時の高温処理においても大きな変形を起こさなかったことが確認できる。

(2) ロードアンロード試験

上記方法で実施例の基板を用いて形成した各磁気ディスクを、回転数 $5400\ \text{rpm}$ の高速で回転する2.5インチ型ハードディスクドライブに搭載し、ロードアンロード（Load Unload、以下、LUL）試験を行った。上記ハードディスクドライブにおいて、スピンドルモーターのスピンドルはステンレス製であった。いずれの磁気ディスクもLULの耐久回数は60万回を超えた。また、LUL試験中にスピンドル材料との熱膨張係数の違いによる変形や高速回転によるたわみが生じると試験中にクラッシュ障害やサーマルアスペリティ障害が生じるが、いずれの磁気ディスクも試験中にこれら障害は発生しなかった。

以上の結果から、本発明によれば信頼性の高い記録再生が可能であることが確認できる。

【 0 0 9 1 】

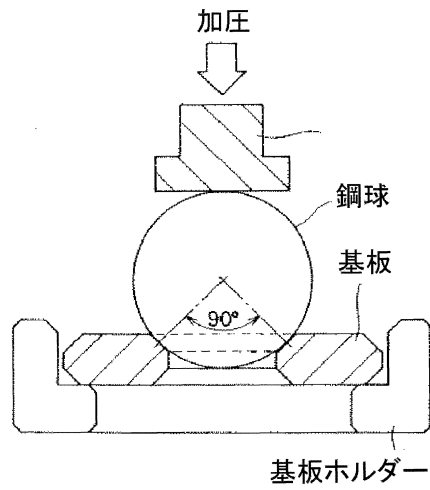
上記方法で実施例の基板を用いて作製した磁気ディスクをレーザー光の照射により磁化反転をアシストする記録方式（熱アシスト記録方式）のハードディスクドライブに搭載し、熱アシスト記録方式の情報記録装置を作製した。これとは別に、作製した磁気ディスクをマイクロ波によりアシストする記録方式（マイクロ波アシスト記録方式）のハードディスクドライブに搭載し、マイクロ波アシスト記録方式の情報記録装置を作製した。このように高Ku磁性材料とエネルギーアシスト記録の組み合わせた情報記録装置によれば、先に説明したように高密度記録を実現することができる。

【 産業上の利用可能性 】

【 0 0 9 2 】

本発明によれば、高密度記録化に最適な磁気記録媒体を提供することができる。

【図 1】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.			F I		
G 1 1 B	5/73	(2006.01)	G 1 1 B	5/73	
G 1 1 B	5/706	(2006.01)	G 1 1 B	5/706	
G 1 1 B	5/84	(2006.01)	G 1 1 B	5/84	Z

審査官 相田 悟

(56)参考文献 特開2005-314159(JP,A)
特開2001-294441(JP,A)
国際公開第2008/062847(WO,A1)
特開平10-152338(JP,A)
特開2005-343729(JP,A)
特開2006-206336(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl.,DB名)
C03C 1/00~14/00
INTERGLAD